Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/709,243	TAKAHASHI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Yahveh Comas	2834	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
310	71	12/10/2005	YC
			·
:			
		\	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH (INCLUDING SEAR		<b>(</b> )
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
	· · ·   · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•		
<del> </del>		